



国家纳米科学中心

National Center for Nanoscience and Technology

研精闡微  
為民關用  
白各院[首页](#) [单位概况](#) [人才队伍](#) [科研成果](#) [合作交流](#) [研究生教育](#) [党群建设](#) [科学传播](#) [仪器设备](#) [信息公开](#)当前位置: [首页](#) > [科研成果](#)

## 科研成果

[> 论文](#)[> 专利](#)[> 标准](#)[> 专著](#)[> 获奖成果](#)

## 科研成果

## 用于测量样品的热电性能样品座及测量方法

专利名称:	用于测量样品的热电性能样品座及测量方法
英文名称:	用于测量样品的热电性能样品座及测量方法
专利类别:	发明
申请号:	201310087023.6
申请日期:	2013-3-19
授权日期:	2016-8-10
专利号:	ZL201310087023.6
第一发明人:	王汉夫
其它发明人:	官爱强;褚卫国;郭延军;金灏;熊玉峰
专利授权日期:	2016-8-10
<a href="#">关闭窗口</a> <a href="#">返回首页</a>	

[理事单位](#) | [机构设置](#) | [挂靠单位](#) | [博士后流动站](#) | [招生咨询](#) | [主任信箱](#) | [违纪违法举报](#) | [友情链接](#)中国科学院  
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

版权所有 © 2017-2018 国家纳米科学中心 京ICP备05064431号-1 京公网安备:

110402500013

地址: 北京市海淀区中关村北一条11号 邮编: 100190

电话: 010-62652116 传真: 010-62656765 Email: webmaster@nanoctr.cn

